

OBJETIVOS

Propiciar o aprofundamento de conhecimentos em difração de raios-x em laboratório e com luz síncrotron e nêutrons para a caracterização microestrutural quantitativa e a análise de tensões residuais e textura cristalográfica nas diversas classes de materiais de engenharia, de modo a possibilitar ao aluno a execução e a aplicação dos métodos de análise de maneira autônoma na solução de problemas práticos na indústria e na pesquisa. Os alunos terão a possibilidade de trazer e analisar suas próprias amostras durante o curso.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Inscrições: 20/02/2020 a 20/03/2020 através do site <https://uspdigital.usp.br/apollo/>.

Duração: 28/03/2020 a 30/10/2021 (19 meses)

Mensalidade: R\$ 1500,00

Aulas: sábados (das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00)

Local: Departamento de Engenharia de Materiais (SMM), campus 2 da USP

Endereço: Av. João Dagnone, 1100, Santa Angelina – CEP: 13563-120 – São Carlos, SP

Contato: contato@fafq.org.br

Fone: (016) 3371-2020

EQUIPE

Prof. Dr. Haroldo Cavalcanti Pinto, SMM-EESC-USP (**Coordenador**) – Contato: haroldo@sc.usp.br; (16) 3373-8290

Profa. Dra. Vera Lucia Arantes, SMM-EESC-USP (**Vice-Coordenadora**) – Contato: vera@sc.usp.br; (16) 3373-8684

Profa. Dra. Marcia Cristina Branciforti, SMM-EESC-USP

Prof. Dr. Rodrigo Santiago Coelho, SENAI-CIMATEC, Salvador

Dr. Alisson Mendes Rodrigues, UFCG-PB

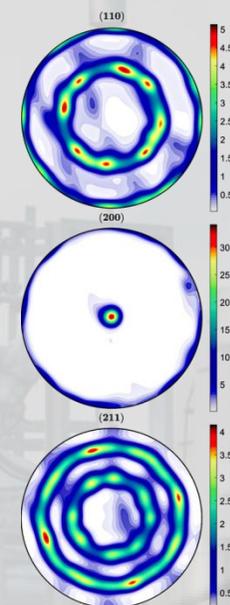
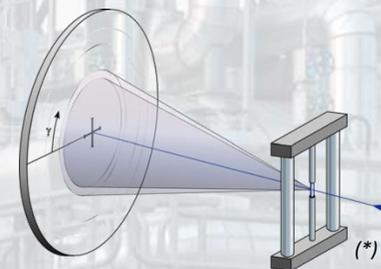
Dr. Alberto Cury Nassour, SMM-EESC-USP

PÚBLICO ALVO

Profissionais graduados da indústria, engenheiros, físicos, químicos e matemáticos interessados em aprofundar seus conhecimentos nos métodos modernos de difração para análise de problemas de engenharia.

DISCIPLINAS

- Os Métodos de Difração e a Análise de Fases
- Técnicas de Difração para a Análise de Tensões Residuais
- Técnicas de Difração para a Análise de Textura Cristalográfica
- Aplicação da Difractometria de Raios-X na Formulação de Materiais Cerâmicos
- Fundamentos da Difração de Raios-X para Materiais Vítreos (Cerâmicos e Metálicos)
- Fundamentos da Difração de Raios-X de Alto Ângulo para Materiais Poliméricos



REALIZAÇÃO



ORGANIZAÇÃO

